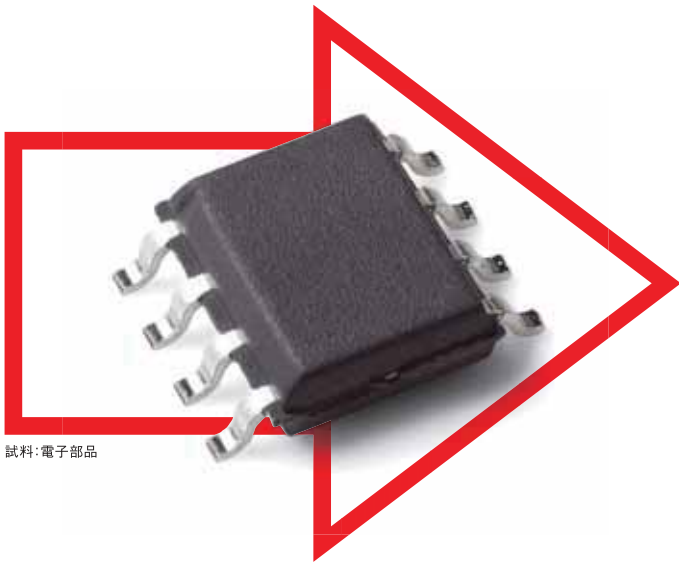
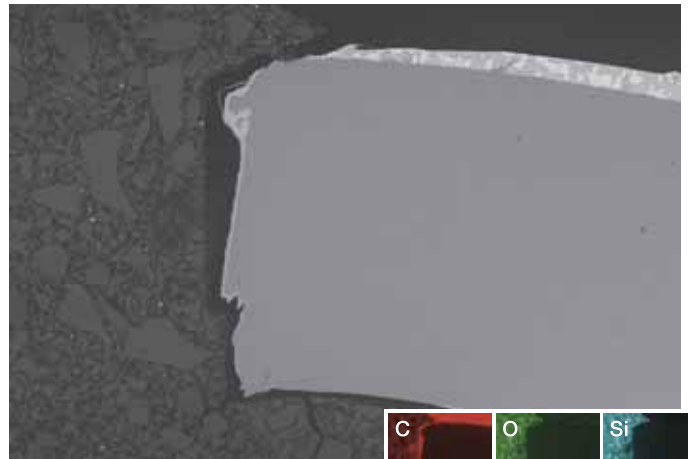


不良がでている...

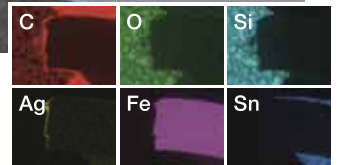
あ、そういうことか!



試料:電子部品



試料:電子部品 観察倍率:250倍  
加速電圧:15 kV 反射電子像



元素分析例

\*EDXはオプションです。

# 画像観察 3分。

※

※試料搭載からSEM像観察までの時間です。

## 卓上SEMは、次のステージへ

コンパクトな卓上サイズで、デジカメのように簡単に使える人気の卓上SEMが、さらなる進化を遂げました。もっと高画質に、もっと使いやすく、もっと直感的に。観察ニーズの“もっと”にお応えする最新テクノロジーを搭載したTM4000シリーズ。卓上SEMの世界を広げ、さらなるイノベーション創出をお手伝いします。

- 1 **さらなる高画質を実現** 新設計の電子光学系搭載
- 2 **設置場所を選ばない** オイルフリーの排気系採用
- 3 **直感的な操作** 目的のデータをレポート作成まで支援

WE STAND BY YOU.

## Miniscope® TM4000 Series

卓上顕微鏡

Science for  
a better tomorrow



 日立ハイテク“SI NEWS”公式Facebookページ  
<https://www.facebook.com/HitachiHighTechnologies.SINEWS>

SI NEWSは、弊社製品を使用した社内外の研究論文を中心に、先端の研究動向・技術情報をご紹介する技術機関誌です。Facebookページでは、本誌内容のご紹介を中心に、皆さまのご研究に役立つ情報をタイムリーに発信してまいります。



 株式会社 日立ハイテク 本社 〒105-6409 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 電話ダイヤルイン(03)3504-6111

インターネットでも製品紹介しております。

URL [www.hitachi-hightech.com/jp/science/](http://www.hitachi-hightech.com/jp/science/)



# 日立卓上SEM 新シリーズ TM4000 II

# HITACHI

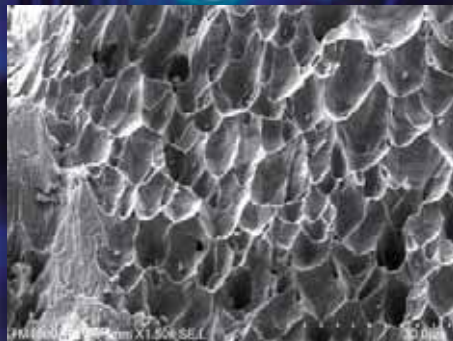
Inspire the Next

品質管理、製品開発に最適なSEM観察をご提案します

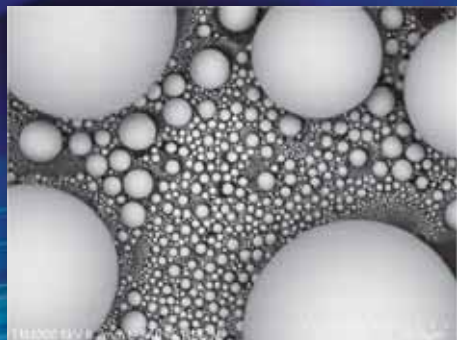
樹脂破面 (無処理)



金属破面



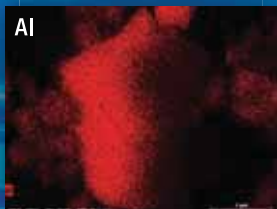
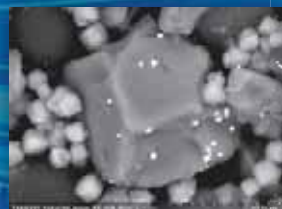
錫粒子



Auボンディングワイヤー (イオンリング処理)

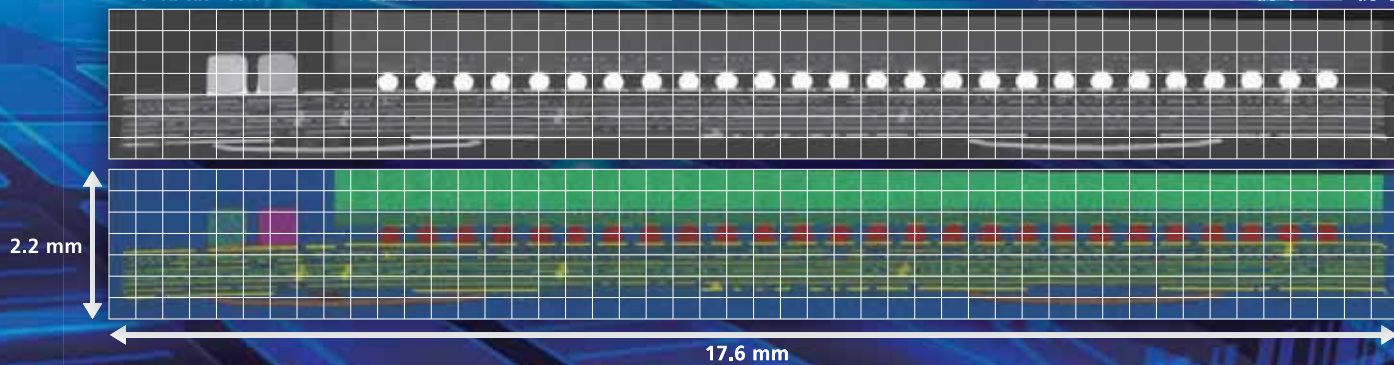


パウダースプレー中銀粒子の元素分析



電子部品断面の広領域解析

7視野×48視野



Science for  
a better tomorrow

私たち日立ハイテックグループの科学分析事業は、技術力と製品開発力を進化させ、ナノテクノロジーやバイオテクノロジーをはじめとするあらゆるフィールドのニーズに的確に応え、さまざまな分野に特化した製品やソリューションの提供を通じて新しい価値を創造していきます。サイエンスリングは、「見る」「計る」「解析する」の領域で、明日の科学と社会の発展に貢献し、科学と社会を繋げて新しい価値を生み出していくという、私たちの社会への約束を表した象徴です。

\*このロゴマークは、株式会社日立ハイテックの日本およびその他の国における登録商標です。